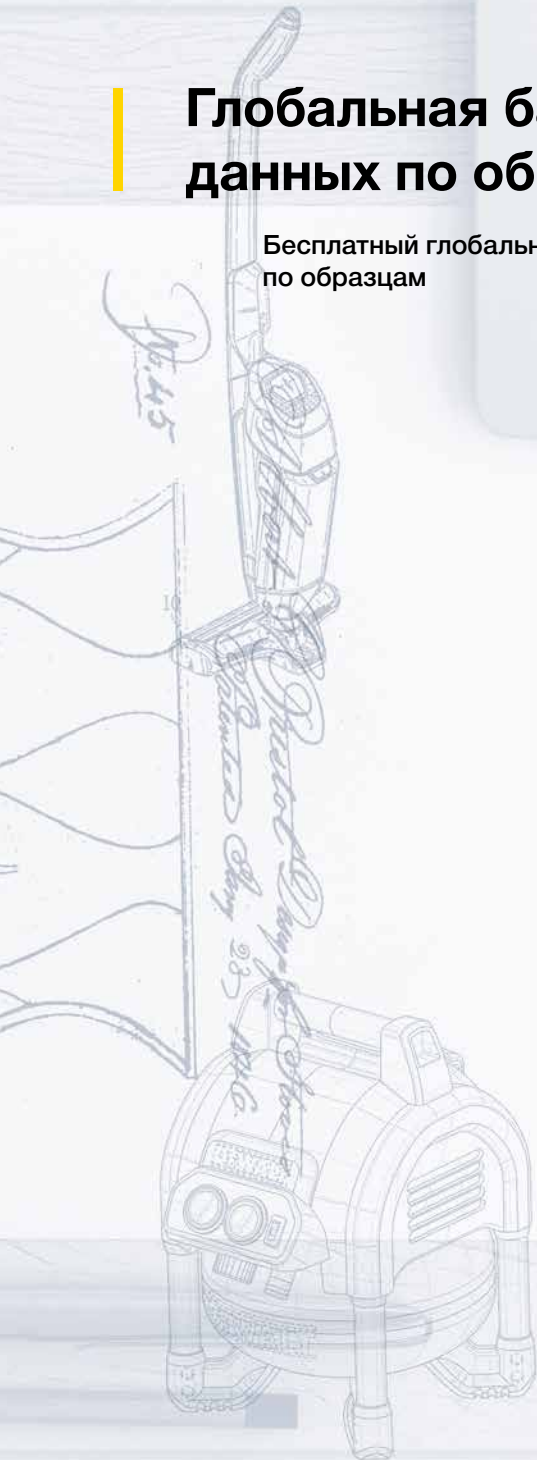


FIG. 8

Глобальная база данных по образцам

Бесплатный глобальный поисковый механизм
по образцам



WIPO

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

FIG. 8

FIG. 5

FIG. 4

SEARCH BY Design Names Numbers Dates Country

Indication of Products

Design class

Description

SEARCH

Глобальная база данных по образцам

Design
Names
Numbers
Dates
Country

Source
Designation
Locarno Class
Reg. Year

Глобальная база данных по образцам – это бесплатный многоязыковой поисковый механизм, позволяющий эффективно использовать большой массив данных по образцам.

Базой данных управляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся вопросами ИС.

Глобальная база данных по образцам содержит огромный массив информации:

- регистрации в рамках Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, административные функции для которой выполняет ВОИС;
- образцы в нескольких национальных регистрационных системах, включая системы Канады, Индонезии, Японии, Новой Зеландии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

Глобальная база данных по образцам содержит миллионы образцов и постоянно пополняется.

Коммерческий успех часто во многом зависит от внешнего вида и тактильных свойств изделия.

В современном мире существует множество конкурирующих между собой изделий, выполняющих схожие базовые функции, и поэтому выбор потребителей часто определяют цена и эстетическая привлекательность товара.

Поэтому очень важно охранять права интеллектуальной собственности (ИС) на свои образцы.

Права промышленной собственности обеспечивают охрану художественного оформления или эстетических компонентов изделия. Такие компоненты имеет огромное множество промышленных и ремесленных изделий: ювелирные изделия, часы, фурнитура, упаковка, тара, автомобили, графический пользовательский интерфейс, звукозаписывающее оборудование и средства связи.

Поиск по существующим образцам позволяет:

- проверить, был ли уже зарегистрирован такой образец, с тем чтобы сэкономить на затратах при попытке получить охрану на уже существующий образец;
- выяснить тенденции регистрации интересующих вас образцов или на интересующих вас рынках.

Глобальная база данных по образцам – это мощный, но простой в использовании механизм.

На домашней странице базы данных доступны различные функции поиска и опции фильтров и сортировки результатов.

Начните с выбора критериев поиска. Вы можете выбрать:

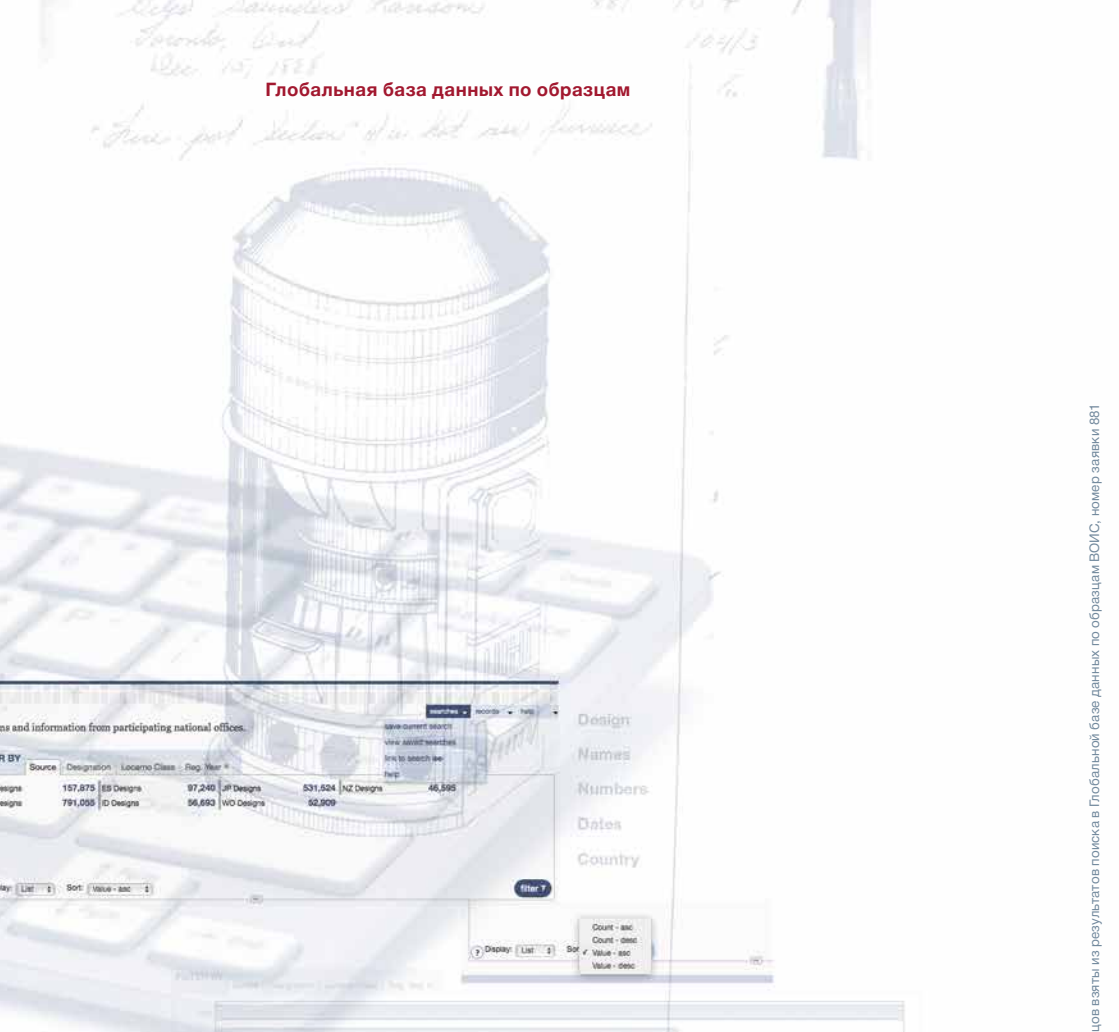
- вид или класс изделия или описание образца;
- имя/наименование правообладателя, автора или представителя;
- номер заявки или регистрации;
- важные даты, например дата регистрации или приоритета; и
- страна или страны подачи заявки или регистрации.

Эти поля содержат подкатегории, что позволяет сужать поиск.

Вы можете уточнить параметры поиска, используя опции фильтров: страна происхождения, указание, класс образца в соответствии с Локарнской международной классификацией и год регистрации.

Фильтры позволяют мгновенно сортировать результаты поиска и выявлять тенденции регистрации образцов в определенных географических районах или сферах деятельности.

Глобальная база данных по образцам



... and information from participating national offices.

Filter BY	Source	Designation	Locarno Class	Reg. Year			
Designs	157,875	ES Designs	97,240	JP Designs	531,524	NZ Designs	46,595
Designs	791,055	ID Designs	56,653	WO Designs	52,909		

- Design
- Names
- Numbers
- Data
- Country

Display | List | Sort

Count - asc
Count - desc
Value - asc
Value - desc

FILTER BY Source Designation Locarno Class Reg. Year



В целях осуществления еще более целенаправленного поиска база данных допускает:

- использование логических операторов И, ИЛИ и НЕ;
- использование операторов группировки;
- использование операторов приближенности;
- поиск по шаблону;
- поиск по неточному соответствию;
- поиск в установленном диапазоне.

Пользователи имеют также возможность сохранять результаты поиска в целях возобновления или проведения повторного поиска по мере актуализации базы данных. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе - это быстро и бесплатно.

На домашней странице выводится список результатов поиска в соответствии с текущими критериями.

Список корректируется по мере изменения вами параметров или фильтров поиска, что позволяет мгновенно видеть, как различные опции сказываются на результатах поиска. При наличии также выводится изображение образца в целях большей наглядности результатов.

Существует два способа просмотра учетных записей в списке результатов поиска:

- в формате списка, который включает опции отображения/скрытия и изменения порядка столбцов;
- в формате сетки, который включает меню изменения порядка отображения результатов поиска.

Все учетные записи в списке результатов поиска легко доступны: чтобы просмотреть данные учетной записи, просто нажмите на нее мышкой.

Каждая учетная запись содержит подробную информацию об образце, такую как номер заявки, дата подачи и дата приоритета, имя/наименование правообладателя и его представителя и т.д.

Глобальная база данных по образцам работает на трех языках: английском, французском и испанском, – и в будущем будут добавлены другие языки.

Пользователи могут запрашивать помощь при проведении поиска на выбранном ими языке через меню «Помощь», расположенное в верхней правой части домашней страницы.

Для максимально эффективного использования базы данных в помощь пользователям также предлагаются бесплатные семинары, более подробная информация о которых содержится на нашем веб-сайте по адресу www.wipo.int/reference/ru/designdb.

**Коммерческий успех часто
во многом зависит от
внешнего вида и тактильных
свойств изделия.**

**Поэтому очень важно охранять
права интеллектуальной
собственности (ИС)
на свои образцы.**

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на веб-сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/

© ВОИС, 2017 г.



Attribution 3.0 IGO license
(CC BY 3.0 IGO)

Лицензия CC не применяется к той
части контента настоящей публикации,
которая подготовлена не ВОИС.

Отпечатано в Швейцарии